



中华人民共和国国家标准

GB/T 25186—2010/ISO 18114:2003

表面化学分析 二次离子质谱 由离子注入参考物质确定 相对灵敏度因子

Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—
Determination of relative sensitivity factors from
ion-implanted reference materials

(ISO 18114:2003, IDT)

2010-09-26 发布

2011-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准等同采用 ISO 18114:2003《表面化学分析 二次离子质谱 由离子注入参考物质确定相对灵敏度因子》。

为了方便使用,本标准做了下列编辑性修改:

——用“本标准”代替“本国际标准”。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:信息产业部专用材料质量监督检验中心。

本标准主要起草人:马农农、何友琴、何秀坤。

引 言

在二次离子质谱分析中,常使用离子注入物质校准仪器。

本标准将提供一种统一的方法:由离子注入参考物质来确定某种元素在特定基体中的相对灵敏度因子,并说明如何确定具有相同基体材料的不同样品中该元素的浓度。